⑲ 日本 園 特 許 庁 (J P)

①実用新案出願公開

@ 公開実用新案公報 (U)

平3-69248

@Int. Cl. '

庁内整理番号

H 01 L 23/50

H 9054-5F ❷公開 平成3年(1991)7月9日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

日考案の名称

砂出 颇 人

樹脂對止型半導体裝置

砂夹 頻 平1-131231

②出 願 平1(1989)11月10日

四考 案 者

鹿児島県薩摩郡入来町副田5950番地 株式会社九州富士通

エレクトロニクス内

砂出 賢 人 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 鹿児島県薩摩郡入来町副田5950番地

株式会社九州富士通士

レクトロニクス

砂代 理 人 弁理士 井桁 貞一

明細書

1. 考案の名称

樹脂封止型半導体装置

2. 実用新案登録請求の範囲

半導体チップとリードフレームの断面を含む上 半面のみが樹脂封止されてなる樹脂封止型半導体 装置において、

封止樹脂と接している該リードフレームの上面 の幅が下面の幅より広いことを特徴とする樹脂封 止型半導体装置。

3. 考案の詳細な説明

〔概 要〕

樹脂封止型半導体装置に用いられるリードフレ ームの形状に関し、

封止樹脂とリードフレームとの接着性を向上させることを目的とし、

半導体チップとリードフレームの断面を含む上半面のみが樹脂封止されてなる樹脂封止型半導体

543

1

拼雜望

で503- 10218

装置において、封止樹脂と接している該リードフレームの上面の幅が下面の幅より広くなるように 構成する。

〔産業上の利用分野〕

本考案は樹脂封止型半導体装置に係り、特に樹脂封止半導体装置に用いられるリードフレームの形状に関する。

近年、各種制御機器や家電製品等の小型・高品質化が進むとともに、これら制御機器に用いられる問胎封止型半導体装置の薄型化および信頼性の向上が要求されている。

〔従来の技術〕

第4図は従来の樹脂封止型半導体装置の断面図を示したものであり、素子載置部1に半導体チップ2が接着・固定され、半導体チップ2はリードフレーム3の先端とポンディング・ワイヤ4によって接続されている。そして封止樹脂5がこれらを被覆し一体的に固定することによって外部から



加わる機械的衝撃あるいは外部雰囲気から半導体チップを保護している。ところが最近、第3図に示したように半導体チップ2とリードフレーム3の断面を含む上半面のみを樹脂封止し、リードフレーム3より下の樹脂を省いたものが用いられるようになった。 従来に比べて薄型化される反面、次に述べるような問題が生じる。

(考案が解決しようとする課題)



いため接着性がさらに弱くなり上述のような障害が起こりやすい。特に、封止樹脂 5 とリードフレーム 3 を上下方向に引き離すような外力が働いた場合、封止樹脂 5 がリードフレーム 3 から脱落し易く、半導体装置の信頼性を損なう原因となる。

そこで本考案は、封止樹脂とリードフレームと の接著性を向上させることを目的とする。

(課題を解決するための手段)

上記課題の解決は、半導体チップとリードフレームの断面を含む上半面のみが樹脂封止されてなる樹脂封止型半導体装置において、封止樹脂と接している該リードフレームの上面の幅が下面の幅より広いことを特徴とする樹脂封止型半導体装置によって達成される。

〔作 用〕

本考案によれば、封止樹脂とリードフレームを 上下方向に引き離すような外力が働いた場合に、 リードフレームの上面に封止樹脂が引っ掛かって



その脱落が阻止され、従来に比べて機械的な衝撃に対する耐性が改善される。

(実施例)

第1図(a)、(b)は本考案の実施例を示す図であり、 同図(a)は断面図、同図(b)はAA′側面図である。 第4図と同一の機能を有するものには同一番号を 付した。リードフレーム3の上面の幅を下面の幅 より広くするためには、例えば、金属板を形状面 積の異なるリードフレーム形状パターンで密着し て挟みこれをマスクとして金属板をエッチングす ることによって得ることができる。このようにし て形成されたリードフレーム3と素子搭載部1に 接着された半導体チップ2をポンディングワイヤ 4で接続した後、モールド金型の上型および下型 で形成されるキャピティ(図示せず)内に保持し、 リードフレーム3の下面Cを上記モールド金型の 下型に密着させて樹脂の回り込みを防ぎ、この状 態でキャピティ内に樹脂を注入してモールドする。 本発館では、リードフレーム3の上面の幅が下

C TIME



〔考案の効果〕

4. 図面の簡単な説明。



第1図は本考案の実施例を示す図、

第2図は本考案の他の実施例を示す側面図、

第3図および第4図は従来例の問題点を示す断

面図、

である.

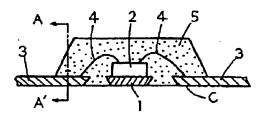
図において、

- 1は素子敵置部、
- 2 は半導体チップ、
- 3 はリードフレーム、
- 4 はポンディングワイヤ、
- 5 は封止樹脂、

である.

代理人 弁理士 井桁 」





(a) 断面图



(b) A A'侧面図

本考案の実施例を示す図 第 1 図



(a)



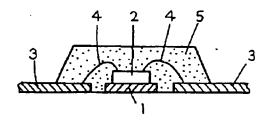
(b)

本考案の他の実施例を示す側面図

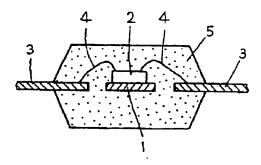
第 2 図

550

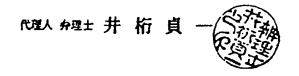
7770 COOK



従来例の問題点を示す断面図 第 3 図



従来例の問題点を示す断面図 第 4 図



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.